



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种用离子束加工样品界面实现背射表征的方法

文献类型: 专利

**作者** 谭军,张磊,张广平,谢天生

**发表日期** 2010-02-24

**专利国别** 中国

**权利人** 中国科学院金属研究所

**公开日期** 2013-06-19

**语种** 中文

**专利申请号** 200610134135.2

**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/68248>]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 谭军,张磊,张广平,谢天生. 一种用离子束加工样品界面实现背射表征的方法. 2010-02-24.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 浏览 | 下载 | 收藏 |
| 78 | 0  | 0  |

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

